активных этапах их жизненного цикла. Для этого необходима реализация электромагнитно-ориентированного технологии системного сопроектирования сопровождения всех фаз сосушествования И корабельных РЭС и объектов-носителей. Ведущую роль в этом процессе играет стадия проектирования ТОМБ, которая задаёт правильность принимаемых организационно-технических решений и определяет объём возможных издержек впоследствии. Качество закладываемых инженернотехнических решений для решения указанных проблем закладывается именно на стадии проектирования ТОМБ.

Таким образом расчётно-оценочная экспертиза ТОМБ по прогнозируемым уровням ЭфЭС является ключевым этапом качественного выполнения проекта.

## Список использованных источников

2. Бурутин А.Г., Балюк Н.В., Кечиев Л.Н.. Электромагнитные эффекты среды и функциональная безопасность радиоэлектронных систем вооружения // «Технологии электромагнитной совместимости»: Научно-технический журнал. – 2010, № 1 (32). – С. 3-27.

## УДК 621.372.54 ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

А.Х. Гильмутдинов<sup>1</sup>, В.А. Мокляков<sup>2</sup>, П.А. Ушаков<sup>3</sup> <sup>1</sup>Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева <sup>2</sup>Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева <sup>3</sup>Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова

Известно, что многие процессы в электрохимии, биологии, физике, характеризуются динамикой дробного порядка, которая математически описывается дифференциальными уравнениями дробного порядка [1]. Для аналогового моделирования таких процессов в настоящее время широко используются элементы с фрактальным пмпедансом (ЭФИ), которые можно реализовать различными спобобами: в виде электрохимических ячеек, в виде лестничных *RC*-цепей, в виде многослойных *RC*-элементов с распределенными параметрами и др. Такие элементы относят к классу фрактальных конденсаторов, поскольку они характеризуются импедансом вида  $Z_F = 1/(p^{\alpha}C_{\alpha})$ , где p – комплексная частота,  $\alpha$  – вещественное положительное число меньшее единицы.

Для моделирования систем с колебательными характеристиками и дробной динамикой необходимо дополнить эти элементы элементами, импедансы которых имеют вид  $Z_F = p^{\beta}L_{\beta}$ , где  $\beta$  – вещественное положительное число меньшее единицы, и фактически являются фрактальными индуктивностями. Наиболее простым способом реализации фрактальной индуктивности является использование конверторов импеданса, нагруженных на фрактальную емкость. Характеристики колебательных фрактальных систем были исследованы в работах [2, 3] с помощью компютерного моделирования.

Целью данной работы является проверка возможностей физической реализации фрактальной колебательной системы, используя образцы элементов с фрактальным импедансом, конструкция которых была предложена в работе [4] и изготовлена по толстопленочной технологии. Фотография образца ЭФИ изображена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Фотография толстопленочного образца ЭФИ

ФЧХ импеданса данного ЭФИ имеет следующие параметры: уровень постоянства фазы  $\varphi_c \pm \Delta \varphi = -40 \pm 2^\circ$  в диапазоне частот от 622 до 10400 Гц. По этим значениям вычислены параметры ЭФИ: фрактальная емкость  $C_{\alpha} = 1,12 \cdot 10^{-8} \text{ Ом}^{-1} \text{ с}^{0.444}$  и  $\alpha = -0.444$ .

На рис. 2, *а* изображена схема конвертора импеданса на ОУ (LM358N) с включенным в нее образцом ЭФИ (рис. 1). На рис. 2, *б* представлен график измеренной ФЧХ импеданса на входе ОУ DA1. Номиналы резисторов R1 – R4 одинаковы и равны 50 кОм.

Видим, что измеренный импеданс характеризует фрактальную индуктивность, дуальную используемой фрактальной емкости, образца ЭФИ. Параметры фрактальной индуктивности, найденные по данным этой характеристики ( $\varphi_c \pm \Delta \varphi = 40 \pm 2^\circ$  в диапазоне частот от 622 до 10400 Гц), следующие:  $L_{\beta} = = 27,94$  Ом с<sup>-0,444</sup>,  $\beta = 0,444$ .

На основе образца ЭФИ и фрактальной индуктивности был создан прототип фрактальной колебательной системы, фотография которого показана на рисунке 3.



Рисунок 2 – *a* – схема, обладающая фрактальным импедансом; *б* – ФЧХ импеданса



1 - образцы ЭФИ, 2 - плата с элементами схемы, 3 - станция NI ELVIS

Рисунок 3 – Стенд для моделирования фрактальной колебательной системы

АЧХ входного импеданса колебательной системы изображена на рисунке 4.



Рисунок 4 – АЧХ импеданса колебательной системы

Частота резонанса составила 660,7 кГц, а добротность - 6,75.

Таким образом, на практике продемонстрирована возможность создания аналоговой модели фрактальной колебательной системы.

Список использованных источников

1. Учайкин В.В. Метод дробных производных / В.В. Учайкин – Ульяновска: Издательство «Артишок», 2008. – 512 с.

2. Ушаков П.А., Князев А.В. Фрактальный параллельный колебательный контур с использованием GIC – схемы // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации: сб. науч. трудов XI-ой Международной научно-практической конференции 19 – 21 марта 2014 года в 4 томах. Том 4. Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2014. С. 230 – 234.

3. Todd J. Freeborn, Brent Maundy, Ahmed Elwakil. Fractional Resonance-Based  $RL_{\beta}C_{\alpha}$  Filters // Mathematical Problems in Engineering, Volume 2013. Hindawi Publishing Corporation. – 10 p.

4. Ushakov P.A., Maksimov K.O., Filippov A.V. Research of fractal thickfilm elements frequency responses // in Proc. 11th Int. Conf. Seminar on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, (Novosibirsk June 30 - July 4, 2010), NSTU, 2010. C. 165–167.

## УДК 621.396.41 ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПРИ КОДОВОМ УПЛОТНЕНИИ СИГНАЛОВ

Е.Е. Зейнулла, В.А. Глазунов

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»

С развитием высоких технологий в микроэлектронике и других науках возникает необходимость применения более надежных, точных,